

ABSTRACT

TITLE : **EXPERT SYSTEMS DETECT HARDWARE FAULTS IN SMARTPHONE USING THE NAÏVE BAYES METHOD (CASE STUDY : DINI CELL)**

NAME : **Moris Nofernanda Alim**

NO BP : **19101152610163**

STUDY PROGRAM : **Information System**

DEGREE : **Strata (S1)**

MENTOR : **1. Syafrika Deni Rizki, S.Kom, M.Kom**
2. Wifra Safitri, S.Kom, M.Kom

Technological developments at this time are very fast and rapid, among them are Android smartphones, the many types of smartphones issued will cause various problems in the form of damage to Android smartphones. Damage can be caused by factory error or user error. This research will help technicians at the early cell to be able to detect damage quickly and accurately, for this reason an expert system is designed to detect damage to website-based smartphones by applying the Naïve Bayes method. An expert system is a report computerized program that tries to imitate the thought processes and knowledge of experts in solving problems. The Naive Bayes method is an algorithm that utilizes probability theory, which predicts future probabilities based on previous experience by utilizing expert knowledge. For this reason, we need a system that can make it easier for technicians who are at the early cell to quickly detect smartphone damage and store all the detection results in the form of data.

Keyword : System, Expert, Damage, Smartphone, Naïve Bayes

ABSTRAK

JUDUL : **SISTEM PAKAR MENDETEKSI KERUSAKAN
HARDWARE PADA SMARTPHONE
MENGUNAKAN METODE NAÏVE BAYES
(STUDI KASUS : DINI CELL)**

Nama : **Moris Nofernanda Alim**

No Bp : **19101152610163**

Program Studi : **Sistem Informasi**

Jenjang Pendidikan : **Strata (S1)**

Pembimbing : **1. Syafrika Deni Rizki, S.Kom, M.Kom**
2. Wifra Safitri, S.Kom, M.Kom

Perkembangan teknologi pada saat ini sangat cepat dan pesat, diantara adalah *smartphone* android, banyaknya jenis *smartphone* dikeluarkan akan menimbulkan berbagai masalah berupa kerusakan pada *smartphone* android. Kerusakan bisa disebabkan oleh kesalahan pabrik atau kesalahan dari pengguna itu sendiri. Pada penelitian ini akan membantu teknisi pada dini cell supaya dapat melakukan deteksi kerusakan dengan cepat dan akurat, untuk itu dirancang sebuah sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan pada *smartphone* berbasis website dengan menerapkan metode naïve bayes. Sistem pakar merupakan program komputerisasi laporan yang mencoba meniru proses pemikiran dan pengetahuan ahli dalam memecahkan masalah. Metode naïve bayes merupakan algoritma yang memanfaatkan teori probabilitas, yang memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya dengan memanfaatkan pengetahuan pakar. Untuk itu diperlukannya suatu sistem yang dapat mempermudah teknisi yang ada pada dini cell melakukan deteksi kerusakan *smartphone* dengan cepat dan menyimpan semua hasil deteksi tersebut berupa data

Kata Kunci : **Sistem, Pakar, Kerusakan, *Smartphone*, Naïve Bayes**